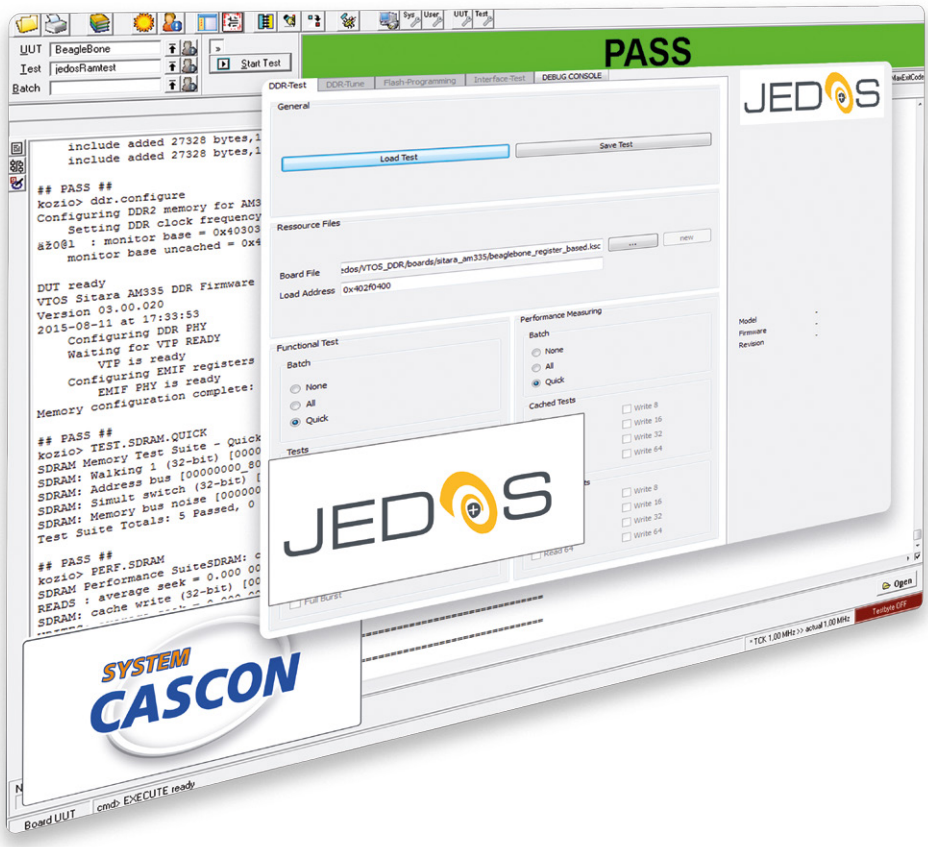
# JEDOS

## Eingebetteter diagnostischer Funktionstest, Kalibrierung und Programmierung




- JTAG Embedded Diagnostics Operating System
- At-Speed/Real Time diagnostischer Funktionstest
- High Speed In-System Flash-Programmierung
- geeignet für Labor und Produktion
- vollständig integriert in die Plattform SYSTEM CASCON™ für Embedded System Access (ESA)

GOPEL electronic
Enjoy Testing

# Technische Daten & Anwendungen

JEDOS – Embedded Test & Diagnostics

## Größte Testabdeckung

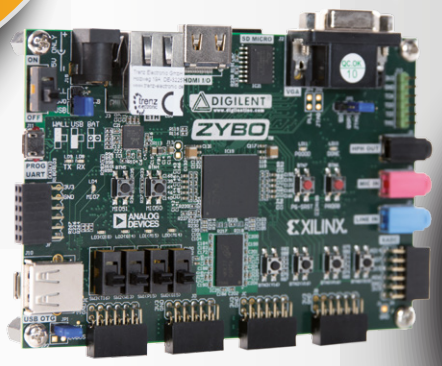
JEDOS ist ein Embedded Test & Diagnostics Betriebssystem der nächsten Generation. Es ist in der Lage, funktionale Schaltkreistests in Echtzeit unter Verwendung des nativen Prozessors durchzuführen. Das liefert maximale Fehlerabdeckung und umfassende Fehlerdiagnose für digitale, analoge und Mixed-Signal-Baugruppen und Module.

## Verwendbar für Labor und Produktion

Unterstützung für Design-Validierung von Prototypen sowie Gang Applikationen im Produktionsprozess.

## Wachsende Zahl unterstützter Prozessoren

Neue JEDOS IP werden kontinuierlich hinzugefügt um die Liste der unterstützten Bausteine zu erweitern. Neben Standard-MCU stehen insbesondere Multi-Core-Prozessoren und FPGA SoC's im Fokus.




Beispiel für volle Anwendungsunterstützung: XILINX ZYNQ7000

## Keine zusätzliche Software-Entwicklung

JEDOS ist ein voll funktionsfähiges Betriebssystem, welches via JTAG geladen wird und keine native Target-Firmware benötigt.

## Einfache Kombination mit anderen Teststrategien

JEDOS ist vollständig integriert in die Softwareplattform SYSTEM CASCON. Dies ermöglicht die einfache Kombination mit Boundary Scan, Embedded Instruments und anderen nicht-invasiven Technologien.

| Funktion | Spezifikation |
|---|---|
| JEDOS Application Commander | Herzstück des JEDOS Betriebssystems. Ermöglicht den Umgang mit funktionalen IP, Systemberichte und Steuerung via JTAG |
| DDR Test | Funktionaler At-speed/ Real time Test von DDR-Komponenten mit wählbaren Algorithmen (address test, burst test, noise test, stress test, cell test) |
| DDR Kalibrierung | Margin Test von DDR I/F vordefinierten Parametern für DDR-RAM-Controller oder automatisierter Abruf falloptimierter Parameter |
| Peripherer I/O-Test | Funktionaler At-speed/ Real time Test von GPIO, UART, PCI, PCIe, Ethernet LAN, USB2.0, USB3.0 |
| Universeller Funktionstest | Laden, Ausführen und dynamisches Steuern vorkompilierter JEDOS-konformer IP, nutzer- oder drittanbietergeneriert für jegliche Art von Funktionstest |
| In-System-Programmierung | High-speed-Programmierung nichtflüchtiger Elemente wie NAND, NOR, SPI, I2C, eMMC, MCU via Streaming über Kommunikationsinterface (USB2.0, USB3.0, LAN) oder Download von externen USB Datenträger |

Aktuelle Informationen zu JEDOS sind auf www.goepel.com/jedos zu finden.
JEDOS wurde entwickelt in Kooperation mit KOZIO, Inc.

Made in Germany

JEDOS

GÖPEL electronic
Enjoy Testing
ISO 9001 zertifiziert

GÖPEL electronic GmbH
Göschwitzer Str. 58/60
07745 Jena · Deutschland
03641 · 6896 0 Fon
03641 · 6896 944 Fax
sales@goepel.com
www.goepel.com
sales@goepel.co.uk
sales@goepelusa.com
sales@goepel.asia
sales@goepel.in

JEDOS/D/10-2017